INX 760 Probe Microscope

Automatische Inspektion und Analyse von Einzelfaser- und Mehrfaser-Steckverbindern

Neue Maßstäbe für die Sichtprüfung von Faserendflächen: Schneller, Einfacher, Robuster, Intelligenter

Das Glasfaser-Prüfmikroskop INX™ 760 ist ideal für Servicetechniker geeignet, da es mit seiner beispiellosen Effizienz stets makellose Glasfaseranschlüsse gewährleistet. Dieses Mikroskop ist das Ergebnis von mehr als 25 Jahren wegweisender Innovation und Erfahrung und setzt neue Maßstäbe für die Inspektion und Analyse der Faserendflächen der nächsten Generationen.

Obgleich die Sichtprüfung von Faserendflächen bei vielen Servicetechnikern inzwischen zur Standardvorgehensweise gehört, stellen Verunreinigungen immer noch die Hauptursache für Störungen in optischen Netzen dar. Da immer mehr neue Verbindertypen auf den Markt gebracht werden, die Anzahl der im Feldeinsatz verwendeten Steckverbindungen steigt, sowie neue Glasfasertechniker die Arbeit aufnehmen, steht die Branche vor einem Wendepunkt, der eine neue Inspektionslösung verlangt: das Glasfaser-Mikroskop INX 760.

INX 760 Probe Microscope

Vorteile

- **Schneller:** Sekundenschnelle Ergebnisausgabe durch echte Automatisierung.
- **Einfacher:** Mühelose Endflächenprüfung durch automatische Inspektion von Mehrfaser-, Einzelfaser- und Duplex-Verbindern.
- **Robuster:** Zuverlässige Prüfleistung mit einem robusten Mikroskop, entwickelt für den Feldeinsatz.
- **Intelligenter:** Für stets fehlerfreie Inspektionen mit reproduzierbaren Ergebnissen.

Leistungsmerkmale

- Vollautomatische Inspektion mit dem schnellsten Arbeitsablauf der Branche mit Automatisierung aller Schritte des Prüfprozesses
- Prüfspitzen mit automatischer Erkennung (AutoID) schließen Fehler bei der manuellen oder RFID-Konfiguration beim Wechsel der Prüfspitzen aus
- Die innovative PanOptic von VIAVI sorgt für die volle Ausnutzung des Sichtfeldes, ohne Kompromisse bei Vergrößerung und Auflösung einzugehen
- VIAVI TPA Enabled für eine Testprozess-Automatisierung, die in jeder Phase der Auftragserfüllung eine bessere Koordinierung, Effizienz und Genauigkeit gewährleistet

Anwendungen

- Rechenzentren
- Vermittlungsstellen
- Kopfstellen
- Unternehmen
- Luft- und Raumfahrt

Neue Maßstäbe für die Sichtprüfung von Faserendflächen

Mit seiner beeindruckenden Geschwindigkeit, Bedienerfreundlichkeit und Präzision erlaubt das Glasfaser-Mikroskop INX 760, die zahlreichen unterschiedlichen Verbindertypen und Anwendungen, die in den heutigen optischen Netzen zum Einsatz kommen, zuverlässig zu prüfen. Das Inspect Before You Connect Konzept der proaktiven Inspektion von Faserendflächen stellt den einwandfreien Betrieb des Glasfasernetzes sicher.

SCHNELLER

Sekundenschnelle Ergebnisausgabe durch echte Automatisierung.

Da die gesamte Inspektion eines 12-Faser-Steckverbinders weniger als 10 Sekunden benötigt, bei einem Duplex-Verbinder nur 6 Sekunden und bei einem Simplex-Verbinder nur 5 Sekunden dauert, ermöglicht das INX 760 den Servicetechnikern, bei jedem Auftrag in Rekordzeit saubere optische Verbinder sicherzustellen.

Makellose optische Verbindungen ... in Rekordzeit

EINFACHER

Mühelose Inspektion durch automatische Konfiguration, Faserprüfung und Auftragsabwicklung.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Mehrfaser-Steckverbindern müssen die Techniker immer häufiger einen Mix aus Mehrfaser-, VSFF-Duplex- und Simplex-Verbindern prüfen. Hier bietet sich das Glasfaser-Mikroskop INX 760 als Universallösung für alle diese Verbindertypen an. Dabei ist die Inspektion von Mehrfaser- oder Duplex-Verbindern genau so einfach wie die Prüfung von Simplex-Verbindern.

Mühelose Inspektion ... aller Verbinder

ROBUSTER

Mit einem Glasfaser-Mikroskop, das sich durch Exzellenz im Feldeinsatz auszeichnet, können Sie in jeder Umgebung eine hohe Leistung erwarten.

Das INX 760 wurde für raue Einsatzbedingungen entwickelt! Die robusten Edelstahl-Prüfspitzen werden fest auf einen Stahlkörper geschraubt, der das optische System im täglichen Einsatz sicher schützt. Ein grifffester, ergonomisch geformter Handgriff sorgt dafür, dass das Mikroskop mit und ohne Handschuhe stets sicher gehalten werden kann. Der Stoßschutzmantel hilft, Beschädigungen beim Einsatz unter extremen Bedingungen zu vermeiden.

Verlässliche Leistung ... unter allen Bedingungen

INTELLIGENTER

Für stets fehlerfreie Inspektionen mit reproduzierbaren Ergebnissen bei allen Verbindern.

Das Glasfaser-Mikroskop INX 760 gibt automatisch präzise und reproduzierbare Analyse-Ergebnisse aus. Die hohe Genauigkeit sorgt dafür, dass selbst kleinste Defekte erkannt und bei der Bewertung der Endflächenbilder des Steckverbinders berücksichtigt werden. Dadurch werden die Ausgabe falsch-positiver Ergebnisse und die Inbetriebnahme verschmutzter Glasfasern vermieden. Die Reproduzierbarkeit der Testergebnisse erhöht das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Glasfaser-Inspektion.

Vertrauenswürdige Testergebnisse ... bei jeder Inspektion

Schnelle Auftragserfüllung durch echten Automatikbetrieb

Das INX 760 automatisiert jeden einzelnen Schritt der Inspektion und gibt ohne jeden zusätzlichen Aufwand schnelle, zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse aus. Da das Glasfaser-Mikroskop Simplex-, Duplex- und Mehrfaserverbinder (MPO) unterstützt, muss der Techniker lediglich die passende Prüfspitze aufschrauben und kann sofort mit der Inspektion beginnen. Das INX 760 automatisiert die Einrichtung, die Scharfstellung (Fokussierung) des Bildes, den Kameraschwenk, die Bildanalyse sowie die Ergebnisspeicherung, die sowohl im Mikroskop selbst als auch im VIAVI TPA Ökosystem erfolgen kann.

Vollautomatische Inspektion mit dem INX 760

SETUP → BILDSCHÄRFE → BILDSCHWENK → ANALYSE → ERGEBNISSPEICHERUNG

Bei Zykluszeiten von weniger als 5 Sekunden für Simplex-Verbinder und von unter 10 Sekunden für 12er Mehrfaserverbinder (MPO) in Verbindung mit dem schnellsten Prüfspitzen-Wechsel der Branche stellt das Glasfaser-Mikroskop INX 760 dem Techniker den branchenweit schnellsten Workflow zur Inspektion von optischen Verbindern zur Verfügung.

Prüfspitzen mit AutoID-Technologie für stressfreie Inspektionen

Das INX 760 nutzt die Prüfspitzen der neuen Modellreihe FPT. Diese robuste Edelstahl-Prüfspitze wurde für den Einsatz unter allen Feldbedingungen entwickelt. Sie ist mit AutoID-Technologie ausgestattet, die das INX 760 automatisch auf den zu prüfenden optischen Verbinder einstellt, ohne dass zusätzliche Schritte erforderlich sind. Zudem werden die Fehler vermieden, die häufig bei der manuellen und RFID-Konfiguration auftreten.

- Müheloser Wechsel zwischen Verbindertypen
- Automatische Konfiguration der optischen Parameter
- Automatisches Laden des zuletzt für die Prüfspitze verwendeten Analyseprofils
- Keine zusätzlichen optischen Komponenten erforderlich
- Robustes Edelstahl-Design
- Schnellwechsel-Kupplungsmuffe
- Optische Anzeige bei korrekter Verbindung

Einfache Befestigung am INX 760

AutoID-Technologie in jeder Prüfspitze

Prüfspitzen für Simplex-, Duplex- und Mehrfaserverbinder (MPO)

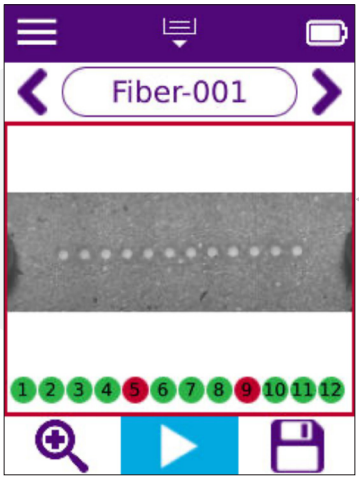
Weitergehende Informationen zum Produkt erhalten Sie auf: viavisolutions.de/INX760

Beispiellose Leistungsmerkmale

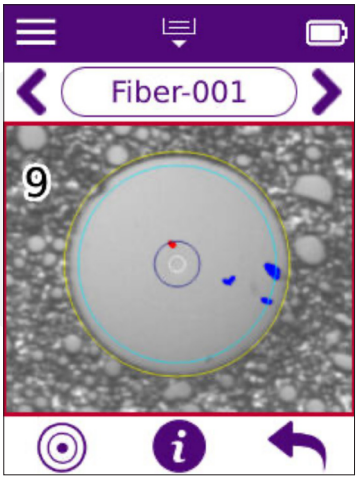
Die innovative PanOptic des INX 760 sorgt dafür, dass das Sichtfeld ohne Kompromisse bei Vergrößerung und Auflösung in vollem Umfang (Edge-to-Edge) ausgenutzt wird. Da das Mikroskop für den gesamten Analyseprozess den gleichen optischen Pfad nutzt, ist bei Bildqualität, Analysezuverlässigkeit und Gesamtgeschwindigkeit eine optimale Leistung gewährleistet.

Die PanOptic setzt völlig neue Maßstäbe für die Inspektion von Mehrfaserverbindern , da sie in weniger als 8 Sekunden sowohl breite Bilder des Sichtbereichs (FOV), einschließlich der Führungsstifte und Führungslöcher am Rand, als auch die Details jeder einzelnen Glasfaser der Gruppe anzeigt.

Inspektion von Mehrfaserverbindern



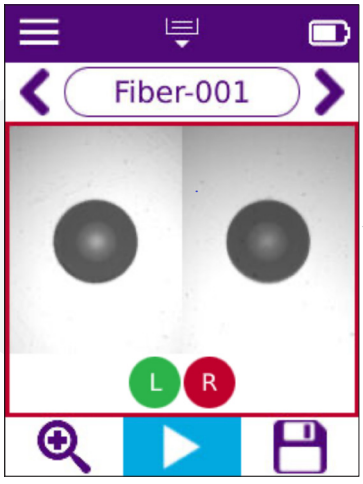
Volles Bild eines MPO-Steckgesichts



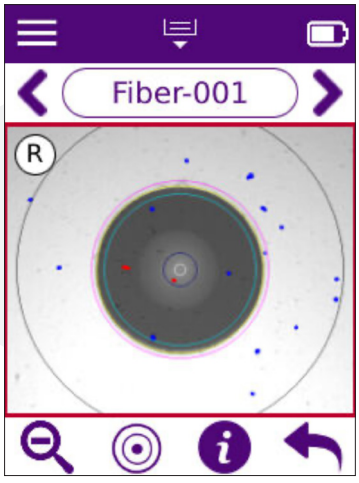
Detaillierte Ansicht der Faser 9 in der Mehrfasergruppe mit Anzeige der Prüfzonen und Defekte

Duplex-Verbinder können mit einem einzigen Test überprüft werden, bei dem beide Verbinder nebeneinander angezeigt und in weniger als 5 Sekunden bewertet werden.

Inspektion von Duplex-Verbindern



Nebeneinander angezeigte Endflächen eines Duplex-Verbinders



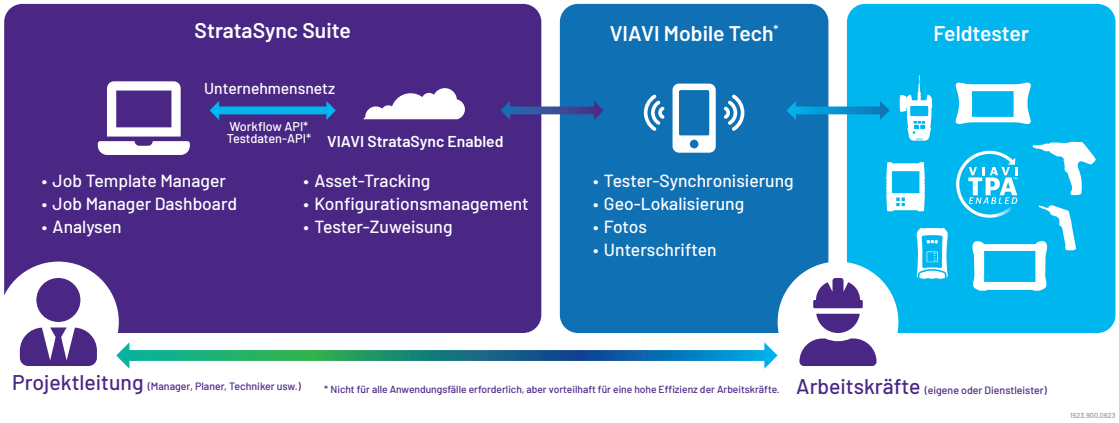
Detaillierte Ansicht der rechten Faser des Duplex-Paares mit Anzeige der Prüfzonen und Defekte

Leistungsmerkmale

Gut vernetzt mit der VIAVI TPA

Das Glasfaser-Mikroskop INX 760 kann in die Testprozess-Automatisierung (TPA) von VIAVI eingebunden werden, um die Arbeitsabläufe im Feldeinsatz zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern und die Sichtbarkeit zu verbessern. Diese systematische, in sich geschlossene Workflow-Lösung vernetzt die Teams mit ihren Testern, um in jeder Phase der Auftragserfüllung eine hohe Reproduzierbarkeit, Effizienz und Genauigkeit sicherzustellen.

VIAVI TPA™ Überblick über das Ökosystem



Mehr erfahren Sie auf: viavisolutions.de/tpa

Technische Daten

Parameter	Beschreibung
Sichtfeld (FOV)	Mehrfaser: 6400 x 1425 µm
	Simplex: 1000 x 1425 µm
Betrachtungsmodi	Live, Inspiziert
Vergrößerungsstufen	Gering, Stark (autom. Zentrierung)
Fokus	Auto (an Einsatz, Auslösetaste), Manuell (Simplex, Duplex)
Schwenk	Auto (Duplex, Mehrfaser), Manuell (Mehrfaser)
Bildanalyse	Auto: IEC 61300-3-35 Edition 2, IEC 61300-3-35 Edition 3
Testergebnisse	Speicherung: Auslösetaste, Auto bei OK, Immer Auto
	Simplex: ≤ 10.000, Duplex: ≤ 5000, 12x1 MPO: ≤ 1500 gespeichert
	oder eine proportionale Kombination davon
Autofokus + Schwenk + Analyse	Simplex: ≤ 4 s, Duplex: ≤ 5 s, 12x1 MPO: ≤ 8 s
Auto-Speichern	Simplex: ≤ 1 s, Duplex: ≤ 1 s, 12x1 MPO: ≤ 2 s
Gerätetasten	Ein/Aus, Auslösetaste, Einstellrad
Display	320 x 240 Pixel (2,4"/6,1 cm) Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung
Statusanzeigen	LED-Ring, LED für Netzbetrieb/Ladeanzeige, Lautsprecher
Stromversorgung	USB-Netzteil, 5 V/2,1 A
Akku	Li-Ionen (vor Ort auswechselbar)
Betriebsdauer	> 4 h (1 x MPO-Test 12x1 + Speichern/Min)
Kabelgebundene Konnektivität	USB-C Anschluss mit optionaler Verriegelung
Kabellose Konnektivität (INX 760)	Bluetooth® 5.2 BLE, WLAN 802.11b/g/n
Befestigungspunkt	Buchse, Durchmesser ¼ Zoll, 20 Gänge/Zoll (1/4-20)
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Rel. Luftfeuchte (Betrieb)	0 % bis 90 %, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Abmessungen (L x H x B)	253 x 191 x 60 mm ohne Prüfspitze
	275 x 191 x 60 mm mit LC-Prüfspitze
Gewicht	0,665 kg ohne Prüfspitze
Prüfspitzen	Simplex, Duplex, Mehrfaser (≤ 2 Reihen, ≤ 16 Faser/Reihe)
	Integrierte AutoID-Technologie
	Edelstahl mit Befestigungsmutter und Befestigungsöse
Kompatibilität zur VIAVI TPA	Ab VIAVI Mobile Tech 5.2 (kabellose Konnektivität benötigt), ab StrataSync 16.1
PC-Berichterstellungssoftware	ReportPRO™

Bestellangaben

Modelle

Bestellnummer	Beschreibung
INX 760	Glasfaser-Prüfmikroskop, automatische Inspektion und Analyse von Simplex-, Duplex- und Mehrfaser-Verbindern, Bluetooth-initiierte kabellose WLAN-Konnektivität, kabelgebundene USB-C-Konnektivität, Laden über USB-C-Port
INX 750	Glasfaser-Prüfmikroskop, automatische Inspektion und Analyse von Simplex-, Duplex- und Mehrfaser-Verbindern, kabelgebundene USB-C-Konnektivität (keine Option zum Ergänzen kabelloser Konnektivität), Laden über USB-C-Port

Kits

Bestellnummer	Beschreibung
INX-760-KIT1	Mikroskop INX 760: automatische Simplex-, Duplex-, Mehrfaserprüfung, BT-/WLAN-Konnektivität
	Prüfspitzen: Einbauverbinder-Prüfspitzen für MPO/PC, MPO/APC
	Kupplung: MPO
	Zubehör: Prüfspitzen-Schutzkappe, Prüfspitzen-Aufbewahrungsbox, USB-Ladenetzteil und Kabel, Tragetasche
INX-760-KIT2	Mikroskop INX 760: automatische Simplex-, Duplex-, Mehrfaserprüfung, BT-/WLAN-Konnektivität
	Prüfspitzen: Einbauverbinder-Prüfspitzen für MPO/PC, MPO/APC, LC/PC, LC/APC, SC/PC, SC/APC
	Kupplung: MPO, LC Duplex, SC Duplex
	Zubehör: Prüfspitzen-Schutzkappe, Prüfspitzen-Aufbewahrungsbox, USB-Ladenetzteil und Kabel, Tragetasche
NX-750-HYP-KIT1	Mikroskop INX 750: automatische Simplex, Duplex-, Mehrfaserprüfung
	Prüfspitzen: Einbauverbinder-Prüfspitzen für MPO/PC, MPO/APC, LC/PC, LC/PC Duplex
	Kupplung: MPO, LC-Duplex
	Zubehör: Prüfspitzen-Schutzkappe, Prüfspitzen-Aufbewahrungsbox, USB-Ladenetzteil und Kabel, Tragetasche

Prüfspitzen

Weitergehende Informationen erhalten Sie in der Auswahlhilfe für Glasfaser-Prüfspitzen und -Adapter: viavisolutions.com/tipguide

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
FPT-MPO-COUPLER	MPO-Einbaukupplung für INX
ZP-HW-00457	SC Duplex-Einbaukupplung
ZP-HW-00458	LC Duplex-Einbaukupplung
FPP-INX7-HOLSTER	Holster
FPP-INX7-TIPC	Prüfspitzen-Schutzkappe
FPP-INX-TCASE1	Prüfspitzentasche
FPP-INX7-BATTERY	Akku
FCPP-PS1	AC-Netzteil/USB-Ladegerät mit Stecker für US, EU, UK, AU
FBPP-DPAC9	Adapterkabel USB-C Stecker auf USB-A Stecker
FCLP-LAN-10	Prüfspitzen-Trageschlaufe, 10 cm

VIAVI Care-Support-Pläne

Steigern Sie bis zu 5 Jahre lang Ihre Produktivität mit den optionalen VIAVI Care-Support-Plänen:

- Nutzen Sie Ihre Zeit effizienter mithilfe von Online-Schulungen, Priorität bei technischer Anwendungsunterstützung sowie schneller Serviceabwicklung.
- Erhalten Sie die Präzision und Leistungsfähigkeit Ihrer Messtechnik bei planbaren und niedrigen Wartungskosten.

Die Verfügbarkeit der Support-Pläne ist von dem jeweiligen Produkt und der Region abhängig. Für manche Produkte und in manchen Regionen werden nicht alle Support-Pläne angeboten. Weitergehende Informationen zur konkreten Verfügbarkeit der VIAVI Care-Support-Pläne für Ihr Produkt und für Ihre Region erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst sowie auf der Webseite: viavisolutions.de/viavicareplan

Leistungsmerkmale

* Nur 5-Jahres-Pläne

Plan	Ziel	Technische Unterstützung	Werksreparatur	Priorität im Servicefall	Online-Schulung	5 Jahre Batterie- und Taschen-absicherung	Werks-kalibrierung	Zubehör-absicherung	Express-Leihgeräte
BronzeCare	Techniker-Effizienz	Premium	✓	✓	✓				
SilverCare	Wartung und Messgenauigkeit	Premium	✓	✓	✓	✓*	✓		
MaxCare	Hohe Verfügbarkeit	Premium	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

viavisolutions.de

Kontakt +49 7121 86 2222
Sie finden das nächstgelegene VIAVI-Vertriebsbüro auf viavisolutions.de/kontakt

© 2025 VIAVI Solutions Inc.

Die in diesem Dokument enthaltenen Produktspezifikationen und Produktbeschreibungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

inx760-ds-fit-nse-de
30194052 903 0125